

晶圆级测量解决方案

是德科技与 Cascade Microtech

配置、安装和支持均可获得可靠保证，增强您的测量信心。

对于器件建模、技术开发、半导体工艺开发和规范、过程控制、元器件定标和试生产来说，精确和可重复的晶圆级测量必不可少。半导体技术正在不断发展，产品从设计到上市的速度越来越快，同时对于更高精度的需求也日益增加。面对这些挑战，用户亟需一款综合的解决方案，以快速和精确地对元器件实施先进的直流和射频测量。

为了配置系统来应对这些挑战，您必须从多家供应商中指定和寻找适合的仪器、晶圆探针台、射频和直流探头以及软件，然后把它们集成在一起，并在开始测试首个器件之前对其进行现场验证。在开始首次测量之前，您可能需要花费几周乃至几个月的时间进行准备，以确保数据的正确性以及在不同地点之间的测量精度。

是德科技和 Cascade Microtech 公司提供了一系列完全综合的元器件测量和器件表征解决方案，迅速解决了这些挑战。Cascade Microtech 晶圆级探针台、微波和直流偏置探头以及校准工具，与是德科技的测试仪器、测量和分析软件完美结合，使您可以对所有元器件执行全方位的测量。

解决方案可以采用多种配置，包括配有半自动或手动探头的全新综合系统，以及针对现有探针台的专用硬件升级。用于器件表征的新型 Keysight WaferPro-XP 测量软件平台也可以添加到现有的晶圆级测量解决方案中。

- 精确、可重复的晶圆级测量
- 预先验证的系统配置
- 符合规定验收标准的安装
- 单一支持联系人
- 解决方案优化专家
- 具有保证的系统配置、安装和支持



晶圆级测量解决方案

这些由是德科技和 Cascade Microtech 携手推出的晶圆级测量和表征综合解决方案为交付晶圆级测量解决方案树立了全新模式，可以为半导体客户提供有保证的配置、安全和支持。

是德科技和 Cascade Microtech 共同保证晶圆级测量解决方案经过特别配置，能够最好地满足您的应用需求。解决方案在交付之前均经过预先验证。当 Cascade Microtech 专家在现场交付并安装完解决方案之后，会按照事先商定的验收标准再次对配置进行验证。Cascade Microtech 解决方案专家还会为用户提供培训，从而进一步加快首次测量。

每个晶圆级测量解决方案均可享受全方位的支持，用户还可以联系本地区精通晶圆级测试与测量的解决方案专家以咨询各种疑难问题。解决方案专家将与您紧密协作优化解决方案，以满足您不断提出的测量、表征和建模要求。Cascade Microtech 提供单点联系方式，帮助客户更迅速地解决问题。

借助有可靠保证的配置、安装和支持，Cascade Microtech 和是德科技的晶圆级测量解决方案可以为您提供快速、精确、性能经过验证的探针，最大限度缩短您开始首次测量所需要的准备时间，确保多个地点的测量结果相互关联。

系统组件

是德科技

N5222x/4x	PNA/PNA-X 微波网络分析仪
B1500A	半导体器件参数分析仪
N6705B	直流电源分析仪
WaferPro-XP	测量软件平台
IC-CAP	建模平台

Cascade Microtech

Summit 12000	200mm 半自动晶圆探针台
Elite 300	300mm 半自动晶圆探针台
WinCal XE	校准软件
Infinity 探头	500 GHz 晶圆探头
ISS	阻抗标准基片校准标准件

如欲了解该解决方案如何满足您的特定需求，请联系是德科技解决方案合作伙伴 Cascade Microtech:

www.keysight.com/find/cascade



是德科技 & 解决方案合作伙伴

扩展解决方案，满足独特需求

是德科技及其解决方案合作伙伴携手，致力于帮助客户应对在设计、制造、安装或支持领域面临的独特挑战。如欲详细了解此项计划、我们的合作伙伴和解决方案，请访问：

www.keysight.com/find/solutionspartner

Cascade Microtech 是包括集成电路 (IC)、光学器件及其他微型器件等在内的先进半导体器件的精密电气测量及测试领域中的全球领导者。

www.cascademicrotech.com

如欲获得是德科技的产品、应用和服务信息，请访问：

www.keysight.com

本文中的产品指标和说明可不经通知而更改
© Keysight Technologies, 2014
Published in USA, August 4, 2014
出版号: 5991-4631CHCN
www.keysight.com